FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

PROPIEDADES DE CRISTALES

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA MEDIANTE RAYOS X

P7.1.2.5

Diagrama digitalde Laue: Investigación de la red cristalina de monocristales

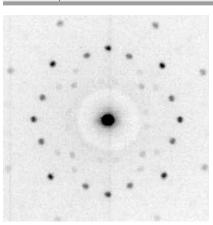
P7.1.2.6

Diagrama digital de Debye-Scherrer: Determinación de la distancia reticular interplanar de muestras de polvo policristalino



Diagrama digitalde Laue: Investigación de la red cristalina de monocristales (P7.1.2.5)

| N° de cat. | Descripción | P7.1.2.5 | P7.1.2.6 |
|------------|---|----------|----------|
| | | _ | _ |
| 554 800 | Unidad básica para rayos X | 1 | 1 |
| 554 866 | Tubo de rayos X de Au | 1 | |
| 554 8281 | Sensor de imágenes de rayos X | 1 | 1 |
| 554 8282 | Blindaje para sensor de imágenes de rayos X | 1 | 1 |
| 554 8291 | Banco de precisión de sensor de imágenes de rayos X | 1 | 1 |
| 554 8383 | Colimador de orificio con cristales Laue | 1 | 1 |
| 554 861 | Tubo de rayos X de Mo | | 1 |
| 667 091 | Pistilo 88 mm | | 1 |
| 667 092 | Mortero porcelana 70 mm Ø | | 1 |
| 666 960 | Cuchara para polvo, 150 x 5 mm | | 1 |
| 673 5700 | Cloruro sódico 250 g | | 1 |
| 673 0520 | Fluoruro de litio, analíticamente puro, 10 g | | 1 |
| | Adicionalmente se requiere: PC con Windows XP/Vista/7/8/10 (x86 o x64) | 1 | |



Patrón de Laue del NaCl y patrón de Debye-Scherrer del NaCl (P7.1.2)

Los rayos X son una herramienta esencial para determinar la estructura de los cristales. Los planos de la red cristalina son identificados mediante los índices de Miller h, k, l, y reflejan los rayos X solo si la condición de Laue o de Bragg se cumple. La distribución de las reflexiones permite calcular el parámetro de red de la estructura cristalina que es investigada.

En el experimento P7.1.2.5, la bremsstrahlung del tubo de rayos X se usa como radiación de rayos X "blanca" para la absorción de *Laue* de monocristales de NaCl y LiF. Desde la posición de los reflejos "coloreados" en un sensor de imagen de rayos X detrás del cristal y desde su intensidad, la estructura del cristal y la longitud de los ejes del cristal pueden determinarse usando las condiciones de Laue. El sensor de imagen de rayos X permite la creación de la grabación de Laue en solo un minuto y la medición digital de reflejos en la computadora.

Para el método de *Debye-Scherrer* en el experimento P7.1.2.6 con radiación $Mo-K_{\alpha}$ se irradian muestras de polvo fino con tamaño de grano reducido. Entre muchos de los cristalitos desordenados, los rayos X encuentran aquellos cuya orientación cumple con la condición de *Bragg*. Los rayos difractados llenan superficies cónicas, cuyos ángulos de abertura ϑ se obtienen de una placa fotográfica. Aquí se determina la distancia interplanar referida a ϑ y sus índices de *Laue h, k, l* y con ello la estructura cristalina de los cristalitos.

El sensible sensor de imagen de rayos X permite la creación de la grabación de *Debye-Scherrer* en solo un minuto y la medición digital del diámetro del círculo y la integral del círculo en la computadora, si la muestra de polvo ha sido cuidadosamente preparada y los rayos difractados tienen una intensidad correspondiente alta.